

MWR-2S-3I无接触少子寿命及红外探伤综合测试仪

产品名称	MWR-2S-3I无接触少子寿命及红外探伤综合测试仪
公司名称	北京合能阳光新能源技术有限公司
价格	.00/套
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:进口 型号:MWR-2S-3I
公司地址	北京市通州区工业开发区光华路16号综合楼A207
联系电话	010-60546837 13718294863

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	进口
型号	MWR-2S-3I	外形尺寸	566*458*568 (mm)
重量	100 (Kg)	产品用途	少子寿命和红外探伤
规格	套		

产品介绍:mwr-2s-3i是一款功能异常强大的无接触少子寿命及红外探伤综合测试仪，能够对单晶硅棒、多晶硅块及硅片提供快速、无接触、无损伤、高分辨率的多功能扫描测试。一方面，其通过微波光电衰减特性原理来测量非平衡载流子寿命的；另一方面，通过近红外对硅材料的光学特性，探测缺陷。并且单晶硅棒、多晶硅块无须进行特殊处理。此设备是太阳能电池硅片企业、多晶铸锭企业、拉晶企业不可多得的测量仪器。

产品特点

- 系统功能强大，少子寿命及缺陷同时测量
- 无接触和无损伤测量
- 自动测量，具有传送系统，可进行连续测量
- 快速测量，测试扫描速度达到2000mm/min
- 测试范围广：包括硅块、硅棒、硅片等
- 应用于硅棒硅块、硅片的进厂、出厂检查，生产工艺过程中重金属沾污和缺陷的监控等

- 性价比高，极大程度地降低了企业的测试成本
- 可以在线实时对产品监控

推荐工作条件

- 温度：18-26 ■ 湿度：10%~80% ■ 大气压：750 ± 30毫米汞柱

技术指标

- 主机尺寸：63cm * 36cm *59cm
- 测试尺寸:190mm*190mm*500mm
- 测试扫描速度:2000mm/min
- 电阻率范围：>0.5 ω .cm
- 硅棒硅块扫描间距：≥ 1mm
- 仪器测试精度：± 3.5%，信号处理偏差 ≤ 2%
- 少子寿命测试范围:0.1 μ s-30ms
- 少子检测激光波长：975nm,测试功率范围：50-500mw
- 红外波长：2300nm,测试功率范围：50mw
- 红外探伤可分辨最小尺寸：0.1mm
- 微波工作频率：10ghz ± 0.5
- 微波测试单元功率：0.01w ± 10%
- 电源：~ 220v 50hz 功耗 < 160w
- 主机重量：32kg

典型客户

德国，瑞士，美国，日本，俄罗斯及国内河北，江西，江苏，浙江，广西，上海，辽宁等地拉晶铸锭客户。

详情欢迎来电咨询：

北京合能阳光新能源技术有限公司

北京市通州区工业开发区光华路16号

电话：010-60546837 -104 传真：01060546837-608

联系人：肖经理18610357221 qq：454972757

email：xiaozongyong@henergysolar.com

公司网站：<http://www.henergysolar.com>